PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03076164 A

(43) Date of publication of application: 02 . 04 . 91

ASAHI GLASS CO LTD

(51) Int. Cl H01L 31/04

(21) Application number: 01211437 (71) Applicant:

(22) Date of filing: 18 . 08 . 89 (72) Inven

(72) Inventor: IMASHIRO NOBUHIKO ADACHI KUNIHIKO

(54) MANUFACTURE OF AMORPHOUS SILICON

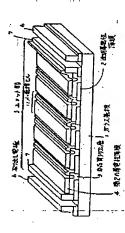
SOLAR CELL

(57) Abstract:

PURPOSE: To stabilize a process for forming a solar cell by electrically connecting two or more units having cells electrically connected, in parallel or in series with each other, and incorporating a step with one of a pair of power output electrodes being nonconductive.

CONSTITUTION: A transparent conductive thin film 2, an amorphous silicon 3 and a second conductive thin film 4 for forming an amorphous silicon solar cell are patterned, and the film 2 is connected in series with a second conductive thin film layer 4 through a patterned part of the amorphous silicon layer in series with each other. After the film 2 is formed, it is patterned to form a power output electrode 6 and a collector electrode 7 of a unit part at both ends of a substrate in an insulating state, and the amorphous silicon layer 3 and the film 4 are sequentially formed. The patterning or insulating step includes a photolithography method or a laser cutting, etc. As a result, its manufacturing cost can be reduced without deterioration of the solar cell, and a process can be stabilized.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



⑩ 日本 国 特 許 庁(JP)

⑩ 特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平3-76164

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月2日

H 01 L 31/04

7522-5F H 01 L 31/04

S

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

図発明の名称

非昌質シリコン太陽電池の製造方法

②特 願 平1-211437

匈出 顯 平1(1989)8月18日

 信 彦

神奈川県横浜市港南区東永谷3-21-19

@発 明 者

安達

邦 彦

神奈川県横浜市神奈川区三枚町543

旭硝子株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目1番2号

0代理人 弁理士内田 明 外2名

明細

1,発明の名称

非晶質シリコン太陽電池の製造方法

- 2 特許請求の範囲

特徴とする非晶質シリコン太陽電池の製造方 法。

- (2) 請求項1記載の非晶質シリコン太陽電池の製造方法において、各ユニット部分と電力取り出し電極とが非導通の状態において各ユニット部分の出力特性を測定後、所望の出力特性を有するユニット部分のみを選択的に第3の導電物を用いて上記電力取り出し電極に接続する工程を含むことを特徴とする非晶質シリコン太陽電池の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明
- 【産業上の利用分野】

非品質シリコン層を光電変換層に用いる非晶質シリコン太陽電池、特に大型の基板上に形成される非晶質シリコン太陽電池の製造方法に関するものである。

[従来の技術]

非晶質シリコン層を光電変換層として用いた 太陽電池は、結晶系太陽電池と比較して、低コ ストであること、接合形成が容易であること、

素子構造上の自由度が高いこと等の利点を有す ることから注目されており、現在開発が進めら れている。このような太陽電池を大面積基板上 に作成する際には、単一の大面積セルを作成す ることはせずに、適当な面積を有する小面積の セルを多数作成し、これらの小面積のセルを直 列もしくは並列に接続し、この小面積セルの配 置に従って所望の特性を得るという方法が取ら れてきている。この方法に関しては公開特許60 - 1782178等に示されるような方法がとられてき た。しかしこのような方法の場合には大面積の 基板上に1個の不良セルなく作成することは非 常に困難であり、不良セルに起因する特性の分 布が生じるために歩留りを低下させる原因とも なっている。これに対応する為に作成したユニ ット部分の特性を測定し、特定の劣るユニット 部分に関して、そのユニット部分と最終的な取 り出し電極との間を切断し電気的に非導通な状 態にしておく方法が提案されている。

コン太陽電池を製造する方法において、少なくとも2個以上のセルが電気的に直列もしくは並列に接続されてなるユニット部と、各ユニット部を電気的に直列もしくは並列に接続し最終的に基板全体の出力を取り出すための一対の電力取り出し電極との間の少なくとも一方が非導通の状態である工程を含むことを特徴とする非晶質シリコン太陽電池の製造方法を提供するものである。

[発明の解決しようとする課題]

しかし、上記のような方法の場合には各ュニット部分の電気特性を測定し、そのユニュ部分の電気特性の良否を判断することを想定した。他のユニットセルも同一の取り出し、しているために特性測定の際には投続されているために特性測定の際に性を有するユニット部分の特性が分離できずいた問題点を有していた。

[課題を解決する為の手段]

使用する装置コストという観点では、従来の方法と比較して改善効果を期待できる。

以下図面を参考にして本発明の非晶質シリコン太陽電池の製造方法を説明する。

第1図は、本発明の非晶質シリコン太陽電池 基板の製造方法の一工程を示す模式断面図であ る。この図の示すように任意の出力電圧が得ら れるように太陽電池を構成する透明導電性薄膜 (2)、非晶質シリコン(3)、および第2の導電 性薄膜(4) は、パターニングされている。さら に透明導電性薄膜(2)と、第2の導電性薄膜層 (4) は非晶質シリコン層のパターニング部を介 して直列に接続されている。 しかし図中(11)で 示した複数の小面積セルから構成されるユニッ ト部分(5) と基板全体の出力を取り出すための 電力取り出し電極(6) との間は電気的に接続さ れていない。このような状態にすることで前述 したような効果を期待できる。電力取り出し電 極(6) は、ユニット部分(5) 形成後、その両側 に形成しても良いし、先ず電力取り出し電極

[実施例]

本発明の方法による非晶質シリコン太陽電池を以下のプロセスで作成した。まず透明絶縁性 基板上に酸化錫薄膜からなる透明導電性薄膜層 を常圧CVD法により450mm 膜厚で堆積し、通

て銀を主成分とする導電性ペーストを用いて取り出し電極との接続を取り太陽電池基板を完成させた。このような方法で作成した基板と、従ニー来の方法、すなわら第2の電極としての膜の堆積後にすでに取り出し電極との間が電気的に接続されている基板を作成し両プロセスの損失を評価した。

常のフォトリソグラフィーの方法で所望の形状 にパターニングした。その後この基板周辺部に 銀ペーストにより電力取り出し電極6を形成し た。プラズマCVD装置に導入し、非晶質シリ コン層からなる発電層を形成した。この時に従 来から知られているように基板側から順に、3 族元素のドープされたp型非晶質シリコン層 (10nm)、何もドープされていない i型非品質シ リコン層(300nm)、および5族元素のドープさ れた n 型 非晶 質 シリコン層 (50nm)の 順 に 堆 積 し た。しかる後に通常のフォトリソグラフィーの 工程によって上記に非晶質シリコン層をパター ニングした。この後、この基板を真空蒸着装置 に導入し、第2の電極としての銀薄膜 (500nm) を堆積し、この薄膜をパターニングしてユニッ ト部分を完成させるとともにユニット部分と電 力取り出し電極間に堆積したAgを除去し、両者 を絶縁状態とした。このようにして作成した基 板の各ユニット部分の出力特性を測定し、不良 ユニット部を特定し、不良ユニット部分を除い

比較した場合には、従来の方法を実施するため には通常のフォトリソグラフィーの工程もしく はレーザによる溶断、もしくは超音波等による 切断を必要とするために装置が大型化し高価格 化することは避け難いものであるが、本発明の 方法によれば、例えば第3の導電物を滴下する 小型の適下装置等のみで接続を実現することが 可能になるために装置コストの低減を実現でき る。又、すべてのユニット部分を取り出し電極 に接続し特性測定を行った結果従来の太陽電池 基板と比較しても、又基板内に不良セルを有し ていない太陽電池基板と比較しても特性的には 優位差は見られなかった。このことは、本発明 による方法の第3の導電性物質を用いたことに よって、特性劣化要因を含まないことを示唆す るものである.

実施例に示した非晶質シリコン層の構造としては、従来から知られているように基板側のTCO側から3族元素のドーピングされたp型非晶質シリコン層/何もドーピングされていない

特開平3-76164(4)

1型非晶質シリコン暦/ 5 族のドークなりは、カースのドークなりのようなのでは、カースを関係を見ている。 1 ののでは、カースを

又、第3の辺電物層の例示では銀を主成分と する辺電性ペーストを示しているが上述したデ バイス構造の場合と同様にこの例に限定される わけではなく、これ以外の従来から知られてい る辺電性ペースト、例えば、ニッケルペースト とかモリ_.ブデンペーストを用いることができる。

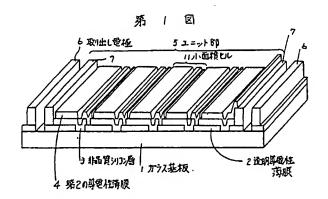
[発明の効果]

以上述べたきたように本発明の方法によって 非晶質シリコン太陽電池を製造することによっ て、従来の方法と比較して太陽電池の劣化を招 くことなく、製造コストを低減し、デバイスデ ザインの自由度を向上させプロセスの安定化を 図ることが可能になる。又上記の改善効果の結 果として太陽電池基板作成時のスループットの 向上を図ることが可能になる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明によるところの非晶質シリコン太別窓池基板の斜視図であり、第2 図は従来の方法の非晶質シリコン太陽電池基板の斜視図である。

代型人内 田 明代型人 获 原 亮 一 代型人 安 西 篇 夫



第 2 図

